

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Echantillonneur de Faisceau Raie Laser Nd:YAG 355 nm, 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur



TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Stock **#29-019** 7 In Stock

-

1

+

€169⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€169,00 prix unitaire
Qté 6-25	€152,00 prix unitaire
Qté 26-49	€135,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Beam Sampler	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	

1.00 ±0.10	Épaisseur (mm):
25.40 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
90	Ouverture Utile (%):
<0.50	Parallélisme (arcmin):

Propriétés optiques

Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
1.458	Indice de Réfraction (n _d):
20-10	Qualité de Surface:
0 ±5	Angle d'Incidence (°):
Laser V-Coat (355nm)	Traitement:
355	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 355nm @ 0 ±5° AOI	
Damage Threshold, By Design: ☐ 7.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz	
Transmitted Wavefront Distortion: 0.167 @ 632.8nm	

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

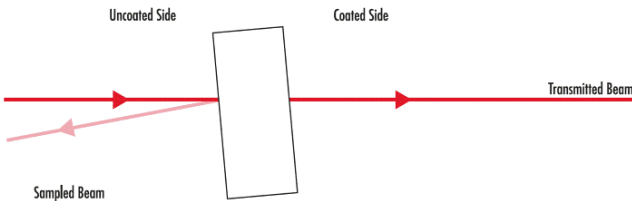
Description produit

- Conception mince de 1 mm pour les applications à espace et poids limités
- La première surface non traitée assure une réflexion de Fresnel
- La seconde surface recouverte d'un traitement AR assure une transmission élevée
- Seuil de dommage laser élevé pour éviter l'ablation par le laser

Les Échantillonneurs Mnces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont conçus pour isoler une petite partie des faisceaux incidents grâce aux propriétés de réflexion de Fresnel et d'antireflet à des fins de contrôle des faisceaux. Ces échantillonneurs de faisceau sont conçus avec une épaisseur de 1 mm pour faciliter les applications où les contraintes d'espace et de poids sont critiques. En outre, un traitement antireflet (AR) avec un seuil de dommage élevé sur la surface deux maximise la transmission et réduit les reflets fantômes. Ces échantillonneurs de faisceau traités sur une seconde surface sont disponibles avec des traitements raie laser comprenant les longueurs d'onde 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm. Les Échantillonneurs Mnces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont dotés d'un substrat en silice fondue UV qui offre une excellente transmission de l'UV à l'IR et un faible coefficient de dilatation thermique. Ces échantillonneurs de faisceau sont idéaux pour les applications où il est nécessaire de contrôler la puissance du faisceau, la distorsion du front d'onde et les pertes optiques.

Remarque : Les Échantillonneurs Mnces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® peuvent être utilisés avec les produits de mesure laser pour surveiller les propriétés des faisceaux, telles que la puissance et le profil des faisceaux, en temps réel.

Informations techniques



Laser Line Beam Sampler

Montures compatibles